

最先端の測定あってこそ、
最先端のデバイスです。



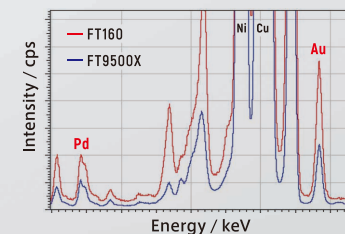
日立ハイテク、進化を加速させる技術。

いよいよ開始された第5世代移動通信システム「5G」。対応する電子デバイスにもさらなる高性能が求められ、使用される部品数は約1.5倍まで増加したと言われています。これに伴い、部品のサイズはさらに微小化、基板の配線はより微細化。この微小化・微細化した電気電子部品に使われるめっきの膜厚測定に対し、高い測定性能と正確な位置合わせを可能にしたのが、日立ハイテクの蛍光X線膜厚計FT160シリーズです。試料にX線を照射し、そこから得られる2次X線(蛍光X線)の強度から、触れることなくめっきなどの金属被膜の厚みを計測。最新のFT160シリーズは、X線光学系にポリキャピラリ方式を採用し、約30 μmφに高輝度な1次X線を照射。旧モデルと比較して1/4の時間*で高精度、微小部測定を実現しています。微小・微細な試料の測定に最適な高分解能自動ステージを採用、面内繰返し精度は±2 μm未満。微小・微細な最先端のめっきも、はがすことなく、その細部を正確に測定します。日立ハイテクには、進化を加速させる技術があります。*当社FT9500X比

Cu/Ni/Pd/極薄Auの測定

FT160と
FT9500Xの
スペクトル比較

Au(6 nm)
Pd(18 nm)
Ni(1 μm)
の膜厚測定例



蛍光 X 線膜厚計
FT160シリーズ



日立ハイテク“SI NEWS”公式Facebookページ
<https://www.facebook.com/HitachiHighTechnologies.SINEWS>

SI NEWSは、弊社製品を使用した社内外の研究論文を中心に、先端の研究動向・技術情報をご紹介する技術機関誌です。Facebookページでは、本誌内容のご紹介を中心に、皆さまのご研究に役立つ情報をタイムリーに発信してまいります。



株式会社 日立ハイテク 〒105-6409 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー

インターネットでも製品紹介しております。URL www.hitachi-hightech.com/jp/science/